

光谱学与光谱分析

离子淌度谱和SIMPLISMA用于痕量有机化合物的检测

张卓勇<sup>1</sup>, 陈国祥<sup>2</sup>, Harrington Peter de B<sup>2</sup>

1. 首都师范大学化学系, 北京市资源环境与GIS重点实验室, 北京 100037
2. Department of Chemistry and Biochemistry, Center for Intelligent Chemical Instrumentation, Clippinger Laboratories, Ohio University, Athens, Ohio 45701-2979, USA

收稿日期 2004-4-9 修回日期 2004-8-28 网络版发布日期 2005-9-26

**摘要** 离子淌度谱(IMS)是检测痕量挥发性有机化合物的灵敏方法。SIMPLISMA(simple-to use-interactive self modeling-mixture analysis)是一种自模型曲线分辨方法。文章将SIMPLISMA用于DMMP, DIMP和DEMP的IMS检测和数据的处理。这些化合物的IMS谱数据经SIMPLISMA处理后, 可以提取出IMS的谱特征, 并去除大部分噪声的影响。经SIMPLISMA提取的IMS谱可被用于其他计算, 如曲线分辨和模式识别等。

**关键词** [离子淌度谱](#) [SIMPLISMA](#) [化学计量学](#) [数据处理](#) [甲基膦酸酯](#)

**分类号** [O657.3](#)

**DOI:**

通讯作者:  
张卓勇

#### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (959KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“离子淌度谱”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [张卓勇](#)

· [陈国祥](#)

· [Harrington Peter de B](#)